

汎用計測機器 三次元座標測定機

Coordinate Measuring Machines

高スループットを実現する、アクティブスキャン技術・
簡単操作を可能にするAI機能で、部品の高精度化に対応します。

東京精密は、日本で初めて三次元座標測定機を開発したパイオニアです。

高スループットを実現するアクティブスキャン技術や、高速スキャン精度を飛躍的に向上するNavigator機能に加え、バーチャルセンター駆動などの革新的なテクノロジーを搭載したXENOS。非破壊で微小な内部欠陥を可視化できるX線CT装置METROTOMシリーズ。高精度・高速・耐温度環境性能を兼ね備えたAXCELシリーズなど、使用目的にマッチした様々な三次元座標測定機を提供いたします。



ZEISS XENOS®

- 超高精度 CNC 三次元座標測定機
- 最大許容長さ測定誤差 (E_0) (μm): $0.3 + L/1000$
- センター駆動から更に進化したY軸ドライブ構造
- 本体の主要構造部品に革新的な炭化ケイ素セラミックスを採用

ZEISS METROTOM

- マイクロフォーカスX線により、非破壊で微小な内部欠陥を可視化できるX線CT装置
- 非破壊検査や内部形状の構造比較、内外寸法の高精度な計測にいたるまで、幅広い用途に対応
- 三次元座標測定機で培われた各軸の制御技術と、超高精度位置決めステージ、高解像度フラットパネルデテクタ、ソフトウェアCALYPSO CTを搭載



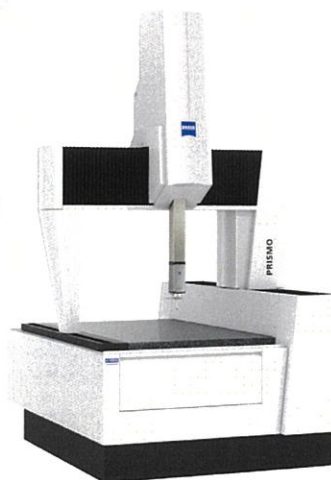
ZEISS ACCURA®

- 大型部品の高精度かつ高速測定に対応し、各種ZEISSスキャンプローブの搭載が可能
- 最大移動速度800mm/s(option)を実現
- 高精度化対応: CAA補正 (Computer Aided Accuracy)



ZEISS PRISMO® シリーズ

- 高速スキャン精度を飛躍的に向上するNavigator機能を搭載
- アクティブスキャンプローブ VAST goldを採用し、スキャン測定、ポイント測定のいずれも、高速・高精度な測定を実現
- 温度の影響を極力避けた斬新なデザイン

ZEISS CONTURA® **NEW**

- 構造やデザインを一新し、生まれ変わったCONTURAシリーズ
- マルチセンサシステムにより、高精度アクティブスキャン測定や首振りスキャン測定、非接触測定に1台で対応可能に
- アクティブスキャンプローブ標準搭載のaktiv、回転式プローブヘッド標準搭載のRDSをラインナップ



ZEISS MICURA

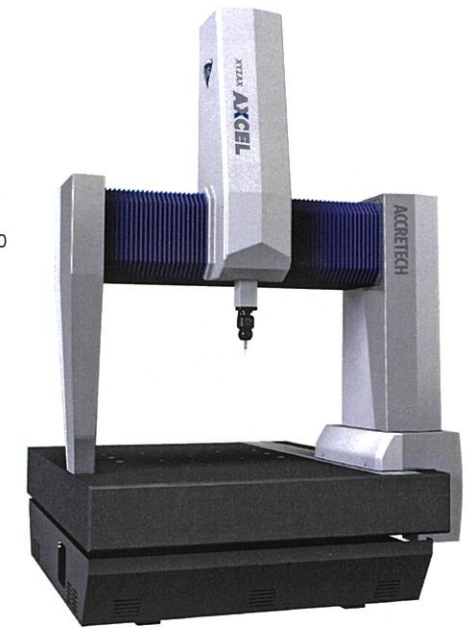
- 最も小さいフットプリントとクラス最大の測定範囲を実現
- 医療器具や歯車等、超高精度測定が要求される様々なアプリケーションに対応



XYZAX AXCEL RDS

ザイザックス AXCEL RDS / PH シリーズ

- 最大許容長さ測定誤差 (E_0 , MPE) (μm): $1.8 + 3L/1000$
- 駆動機構の見直しにより実現した、驚異のスピード
駆動速度 最大 700 mm/sec、
加速度 最大 2300 mm/sec²
- 格段に向上した耐環境性能
精度保証温度 15℃ ~ 30℃
- 2軸回転式ヘッド RDSと
スキャンプローブ VAST XXTを搭載した
スキャン測定モデル (RDS)
- オプションのラインレーザプローブ、画像プローブ搭載で
非接触測定にも対応 (RDS)
- 設置環境や予算に応じて様々な仕様を選択できる
ポイント測定モデル (PH)



XYZAX AXCEL PH

ザイザックス mju NEX シリーズ

- 高剛性リニアガイドX、Y (右)、Z軸とエアベアリングY (左) 軸を併用したハイブリッド構造で、エア消費量を1/4に
- 消費電力を大幅に低減して、ランニングコストを抑制
- Y軸測定範囲 760 mm の5/8/4 サイズを新たにラインナップ
- リアルタイムスケール温度補正機能と振動に強く・長いスタイラスが利用できるTP200Bを搭載
- 最大許容長さ測定誤差
 E_0 , MPE: $2.2 + L/250 \mu\text{m}$ (18℃ ~ 22℃)



ザイザックス SVF NEX シリーズ

- RVFシリーズのデザインを一新
- 新しく生まれ変わったエントリーモデルのマニュアル三次元座標測定機
- 長時間測定でも疲れない軽量設計
- 測定・ターミネート・中間点の操作スイッチを手元で操作でき、Z軸から手を離さずに測定可能

ZEISS O-DETECT **NEW**

- 広視野かつ高精度、そのうえ簡単に操作できる革新的な三次元画像測定機
- ISO 10360-7に準拠し、かつ3次元の長さ測定誤差を保証
- プログラム作成も測定も簡単に実行できる、オーバービュー・イメージ機能



ZEISS O-INSPECT

- さまざまなワークと評価範囲をカバー
- 接触式センサ VAST XXT を標準装備
- 画像センサ テレセントリックズームレンズ Discovery を標準装備
- 高さ方向の非接触形状測定が可能